

СОСТОЯНИЕ ПРИМЕСИ НИКЕЛЯ В ТЕЛЛУРИДЕ КАДМИЯ

В. В. Слынько, П. И. Бабий, Р. В. Гамерник, Ю. П. Гнатенко

Институт проблем материаловедения, 274001, Черновцы, Украина
(Получена 19 июля 1993 г. Принята к печати 7 октября 1993 г.)

Исследованы спектры примесного поглощения и фотогальванического тока кристаллов CdTe, легированных никелем в концентрации $10^{18} \div 5 \cdot 10^{19} \text{ см}^{-3}$. Установлено, что никель находится в двух зарядовых состояниях — Ni^{2+} ($3d^8$) и Ni^+ ($3d^9$).

Энергии донорных и акцепторных состояний, полученные по спектрам фотогальванического тока и эффекту Холла, находятся в приемлемом согласии. Однако обнаруженные глубокие уровни нельзя приписать чисто примесным состояниям.

Учитывая отсутствие параметрической составляющей восприимчивости в кристаллах CdTe : Ni, а также сильную компенсацию свободных носителей ($n = p = 10^7 \div 10^8 \text{ см}^{-3}$ при $T = 300 \text{ K}$), сделан вывод об образовании нейтральных комплексов, глубина залегания которых и определена в настоящей работе.

При исследовании магнитной восприимчивости и магнитной анизотропии было обнаружено, что примеси группы железа — Sc, Ti и Ni — не сохраняют собственный магнитный момент в решетке CdTe [¹].

Отсутствие локализованных магнитных моментов в CdTe : Sc [²] связано с тем, что $3d^1$ -электроны становятся свободными и образуют примесную донорную зону. В отличие от CdTe : Sc кристаллы CdTe : Ti являются высокомягкими и концентрация электронов при $T = 300 \text{ K}$ составляет $10^7 \div 10^8 \text{ см}^{-3}$. Такие низкие концентрации обусловлены образованием нейтральных комплексов ($\text{Ti}_{\text{Cd}}V_{\text{Cd}}^{\ell}$)*, для которых глубина залегания уровней составляет $E_s = E_c = (0.73 \pm 0.03) \text{ эВ}$.

Настоящая работа является продолжением предыдущих исследований и посвящена изучению состояния примеси никеля в теллуриде кадмия. С этой целью исследованы спектры примесного поглощения и фотогальванического тока, а также привлечены экспериментальные результаты по магнитным [¹] и кинетическим свойствам [³].

Результаты экспериментальных исследований и их обсуждение

Монокристаллы CdTe:Ni получены методом Бриджмена, при этом легирующая примесь вводилась в ростовую шихту.

Спектры примесного поглощения измерены на монокристаллах с естественной огранкой при $T = 4.5 \text{ K}$ на спектрометре КСВУ-23. Спектры фотогальванического тока получены при $T = 77 \text{ K}$ с помощью спектрометра В7-30 методом сканирования по спектру от меньших энергий падающих квантов к большим. В соответствии с применяемой методикой [⁴] на графиках знак фотогальванического тока (ФГТ) соответствует знаку заряда на передней грани кристалла, т. е. возбужденные носители имеют противоположный знак.

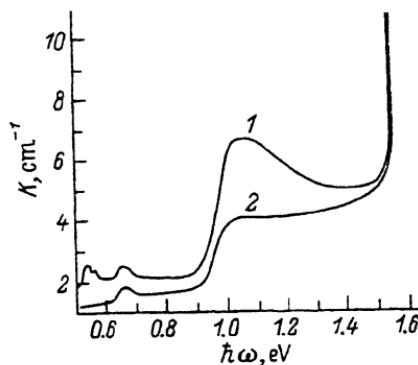


Рис. 1. Спектры примесного поглощения K в образцах CdTe : Ni. N_{Ni} , см^{-3} : 1 — $5 \cdot 10^{19}$, 2 — $5 \cdot 10^{18}$.

По сравнению с нелегированным материалом в спектрах примесного поглощения, полученных на монокристаллах CdTe : Ni при концентрациях атомов никеля $N_{\text{Ni}} = 5 \cdot 10^8$ и $5 \cdot 10^{19} \text{ см}^{-3}$, обнаружены полосы дополнительного поглощения с максимумами при 0.63 и 1.03 эВ (рис. 1, кривые 1, 2). Кроме того, при $N_{\text{Ni}} = 5 \cdot 10^{19} \text{ см}^{-3}$ обнаружена полоса 0.54 эВ (рис. 1, кривая 1).

В промежуточном кристаллическом поле теллурида кадмия T_d -симметрии основное состояние 3F иона Ni^{2+} ($3d^8$) расщепляется на три терма ${}^3T_1(F)$, ${}^3T_2(F)$ и ${}^3A_2(F)$ [5]. При этом основной терм ${}^3T_1(F)$ с учетом спин-орбитального взаимодействия распадается на четыре уровня Γ_1 , Γ_4 , Γ_3 , Γ_5 , нижним из которых является синглет Γ_1 с нулевым магнитным моментом. Основное состояние 2D иона Ni^{2+} ($3d^9$) расщепляется на два терма ${}^2T_2(D)$ и ${}^2E(D)$ [6].

Наблюдаемые полосы 0.63 и 1.03 эВ характерны для ионов Ni^{2+} в соединениях $\text{A}''\text{B}^{\text{VI}}$ и обусловлены внутрицентровыми переходами с основного уровня ${}^3T_1(F)$ на уровни ${}^3T_2(F)$ и ${}^3A_2(F)$ соответственно. Обнаруженная полоса поглощения при 0.54 эВ соответствует электронному переходу с уровня ${}^2T_2(D)$ на ${}^2E(D)$ в ионе Ni^{2+} .

Таким образом, при концентрации вводимых атомов никеля $N_{\text{Ni}} = 5 \cdot 10^{19} \text{ см}^{-3}$ в CdTe обнаружено два зарядовых состояния примеси, Ni^{2+} и Ni^{2+} при $N_{\text{Ni}} = 5 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$ — только состояние Ni^{2+} .

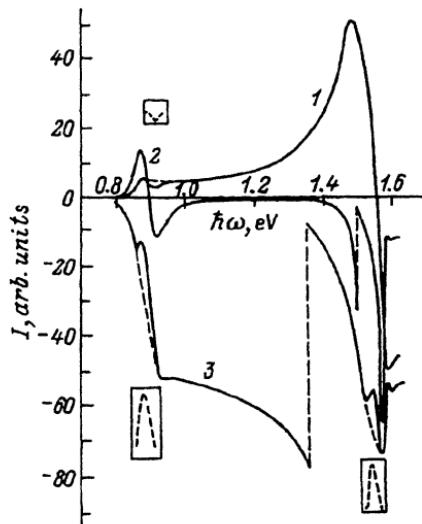
Все полосы, связанные с внутрицентровыми переходами, заметно уширены. Такое уширение существенно больше уширения, обусловленного электрон-фононным взаимодействием. Можно предположить, что оно вызвано взаимодействием дискретного примесного состояния с зонными состояниями CdTe, т. е. основное состояние никеля находится ниже потолка валентной зоны. Поглощение в спектральном диапазоне от 0.9 эВ до края обусловлено наложением фотоионизационного и внутрицентрового переходов.

В спектрах ФГТ (рис. 2) при $N_{\text{Ni}} = 10^{18}$ и 10^{19} см^{-3} в области 0.87 эВ наблюдаются полосы положительной полярности (кривые 1, 2). При энергии возбуждающих квантов 0.92 эВ наблюдается полоса отрицательной полярности на фоне тока положительной полярности в кристаллах с $N_{\text{Ni}} = 10^{18} \text{ см}^{-3}$ (кривая 1) и такая же полоса на фоне тока отрицательной полярности при $N_{\text{Ni}} = 10^{19} \text{ см}^{-3}$ (кривая 2). В образцах с $N_{\text{Ni}} = 5 \cdot 10^{19} \text{ см}^{-3}$ проявляются аналогичные полосы на фоне тока отрицательной полярности (кривая 3).

Согласно применяемой методике, появление в спектрах полосы положительной полярности свидетельствует о фотоионизации электронов с примесного уровня в зону проводимости, а полосы отрицательной полярности — о возбуждении электронов валентной зоны на примесный уровень.

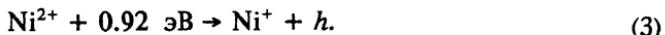
Полоса 0.87 эВ положительной полярности может соответствовать одному из фотоионизационных процессов:

Рис. 2. Спектры фотогальванического тока I в образцах CdTe : Ni. N_{Ni} , см^{-3} : 1 — 10^{18} , 2 — 10^{19} , 3 — $5 \cdot 10^{19}$.



эВ обязан состоянию Ni^{2+} , возникающему в результате фотоионизационного процесса (1).

Полоса 0.92 эВ отрицательной полярности связана с возбуждением электронов валентной зоны на примесный уровень $E_v + 0.92$ эВ (или с фотоионизацией дырки с примесного уровня в валентную зону). По данным фото-ЭПР такой акцепторный уровень создается состоянием Ni^+ [9]. Таким образом, реакцию фотоионизации, которая соответствует полосе 0.92 эВ, можно записать как



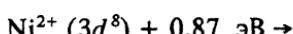
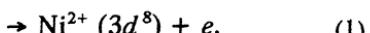
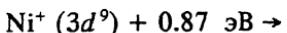
Если определить положение акцепторного уровня $E_v + 0.92$ эВ относительно дна зоны проводимости и сравнить его с положением донорного уровня $E_c = -0.87$ эВ, то получим, что состояние Ni^{2+} находится ниже состояния Ni^+ . Последнее согласуется с порядком расположения ионов никеля в CdTe в зависимости от зарядового состояния, приведенным в работе [8].

Необходимо отметить, что в противоположность спектрам оптического поглощения спектры ФГТ указывают на существование двух зарядовых состояний, Ni^+ и Ni^{2+} , во всех исследованных образцах с $N_{Ni} = 10^{18}$, 10^{19} и $5 \times 10^{19} \text{ см}^{-3}$.

Рассмотрим особенности в спектрах ФГТ при энергиях фотонов выше 1.4 эВ. При $N_{Ni} = 10^{18} \text{ см}^{-3}$ наблюдается интенсивная полоса положительной полярности в области 1.49 эВ, которая соответствует ионизации электронов с акцепторных уровней $E_v + 0.09$ эВ в зону проводимости. Сильное нарастание ФГТ в области переходов зона—зона соответствует p -типу проводимости.

Полоса ФГТ отрицательной полярности с максимумом при 1.56 эВ, которая обнаруживается в образцах с $N_{Ni} = 10^{19} \text{ см}^{-3}$, связана с возбуждением электронов из валентной зоны на донорный уровень $E_c = -0.03$ эВ. Аналогичная полоса имеется и при $N_{Ni} = 5 \cdot 10^{19} \text{ см}^{-3}$ с той лишь разницей, что на левом ее крыле появляется провал, который можно интерпретировать как наложение на полосу отрицательной полярности полосы положительной полярности с максимумом при 1.54 эВ. Последняя связана с ионизацией электронов с акцепторного уровня $E_v + 0.05$ эВ в зону проводимости.

Обратимся к результатам исследования кинетических эффектов [3]. Концентрация свободных носителей в CdTe : Ni составляет $10^7 \div 10^8 \text{ см}^{-3}$ при



Отсюда следует, что донорный уровень $E_c = -0.87$ эВ создается либо состоянием Ni^{2+} , либо состоянием Ni^{3+} .

В [7, 8] показано, что донорный уровень Ni^{3+} не может реализоваться в CdTe, поскольку находится несколько ниже вершины валентной зоны. Следовательно, донорный уровень $E_c = -0.87$

$T = 300$ К, т. е., как и в случае CdTe : Ti, близка к собственной. Энергии примесных уровней в образцах с $N_{\text{Ni}} = 5 \cdot 10^{18}$ и 10^{19} см $^{-3}$ определены по зависимости $\lg(RT^{3/2}) = f(10^3/T)$ и соответственно равны $E_i = E_c - (0.07 \pm 0.03)$ эВ и $E_i = E_v + (0.81 \pm 0.03)$ эВ.

Можно считать, что энергии донорных и акцепторных уровней, полученные по спектрам ФГТ и эффекту Холла, находятся в приемлемом согласии. Однако указанные глубокие уровни нельзя приписать чисто примесным состояниям. При измерении магнитной восприимчивости кристаллов CdTe : Ni нами не обнаружено парамагнитной составляющей χ_p в интервале температур 77—300 К. Последняя, как известно, определяется нескомпенсированными спиновыми моментами электронов незаполненной 3d-оболочки. Поскольку основное состояние атома никеля немагнитно, составляющая χ_p должна определяться возбужденными состояниями, пока величина kT не станет сравнимой с энергетическим расстоянием между основным и первым возбужденным состояниями [10].

Отсутствие χ_p дает основание считать, что в матрице CdTe происходит полное заполнение 3d-оболочки атома никеля, обладающей нулевым спиновым магнитным моментом. Недостающие электроны в почти полностью заполненной 3d⁸- или 3d⁹-оболочке иона никеля можно рассматривать как дырки с положительным эффективным зарядом [11]. Естественно предположить, что ионы никеля взаимодействуют с отрицательно заряженными вакансиями кадмия и образуют нейтральные комплексы, глубина залегания которых определена в настоящей работе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] П. И. Бабий, Н. П. Гавалешко, Ю. П. Гнатенко, Р. Д. Иванчук, А. В. Савицкий, В. В. Слынько, Е. И. Слынько. Препринт ИФ АН УССР, 43, № 3. Киев (1983).
- [2] П. И. Бабий, В. В. Слынько, Ю. П. Гнатенко, П. Н. Букивский, М. И. Илащук, О. А. Парфенюк. ФТП, 24, 1444 (1990).
- [3] В. В. Слынько, П. И. Бабий, Р. В. Гамерник, Ю. П. Гнатенко, О. А. Парфенюк, М. И. Илащук. Тез. докл. III Всес. н.-техн. конф. «Материаловедение халькогенидных полупроводников», 1, 51. Черновцы (1991).
- [4] Р. В. Гамерник, Ю. П. Гнатенко, А. С. Кроучук, З. С. Пославский. УФЖ, 33, 1167 (1988).
- [5] H. A. Weakliem. J. Chem. Phys., 36, 2117 (1962).
- [6] G. Roussol, G. Nagel, H. G. Schulz. Z. Phys. B: Condens. Mater., 53, 95 (1983).
- [7] В. И. Соколов. ФТГ, 29, 1848 (1987).
- [8] V. I. Sokolov, K. A. Kikoin. Sov. Sci. Rev. A. Phys., 12, 147 (1989).
- [9] G. Brunthaler, W. Janisch. Acta Phys. Polon., A71, 355 (1987).
- [10] J. P. Mahoney, C. C. Lin. J. Chem. Phys., 53, 4286 (1970).
- [11] С. Крупичка. Физика ферритов и родственных им магнитных окислов, 1. М. (1976).

Редактор Л. В. Шаронова